

SEM-FIB a IMEM-CNR: caratteristiche e potenzialità

[Seminario](#) [1]

Relatore: Giovanna Trevisi

Relatore info: IMEM-CNR

Relatore email: giovanna.trevisi @ imem.cnr.it

Abstract:

Nel seminario saranno illustrate le caratteristiche del sistema SEM-FIB Zeiss Auriga Compact dell'Istituto IMEM-CNR. Sulla base di esempi di attività svolte negli ultimi anni in Istituto, saranno mostrate le attuali potenzialità dello strumento in diverse modalità: SEM (microscopia elettronica), EDX (analisi composizionale), GIS (deposizione di metalli) e FIB (microscopia, incisione e impiantazione a fascio ionico). Saranno inoltre elencati alcuni possibili sviluppi del sistema in grado di ampliarne le attuali potenzialità e soddisfare le esigenze di nuove attività di ricerca.

Programma:

Inizio data: 21/06/19

Ora data: 11:30

Fine data: 21/06/19

Ora data: 12:30

Sede Manifestazione: Sala A - IMEM

Modalità di accesso: Ingresso libero

Allegato:  [20190621.pdf](#) [2]

Collegamenti

[1] <https://www.imem.cnr.it/it/taxonomy/term/74>

[2] <https://www.imem.cnr.it/sites/default/files/20190621.pdf>